



PLF3232-x.60

SMARFLEX Nanopositionier-Scanner nutzen die Vorteile piezobetriebener mechanischer Biegungen zur Realisierung hochpräziser Positionieraufgaben bis zu mehreren 100 µm.

Der PLF3232-x.60 bietet einen Scanbereich von 60 µm in X-Richtung. Mit 30 g ist er sehr leicht und mit 32 x 32 x 12 mm auch recht kompakt.

Scanbereich: > 60 µm Scan-Richtung: X Abmessungen: 32 x 32 x 12 mm

	Mechanical
Stiffness [N/µm]	0,5
Scan Range [µm]	> 60
Max. Normal Force [N]	5.0
Dimensions [mm]	32 x 32 x 12
Weight [g]	30
	Material
Base Material	Titanium(-TI) / Aluminum base (-Al)
	Open-loop
Open-Loop Resolution MCS2 [nm]	MCS2: <1
	Closed-Loop
Sensor Resolution MCS2 [nm]	MCS2: 1 (S)
	Options
Vacuum Options	HV (10 ⁻⁶ mbar)
Non-Magnetic Option	Yes (- NM)